

3. PRZEDZIAŁY UFNOŚCI

Definicja. Przedziałem ufności dla parametru $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$ na poziomie ufności $1 - \alpha$, gdzie $\alpha \in (0, 1)$, nazywamy przedział (θ_1, θ_2) , gdzie $\theta_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ i $\theta_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ to mierzalne funkcje próby takie, że $\theta_1 \leq \theta_2$ i

$$P(\theta \in (\theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n))) = 1 - \alpha \text{ dla każdego } \theta \in \Theta. \quad (1)$$

Końce przedziału ufności $\theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ i $\theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ to zmienne losowe. Dla niektórych realizacji próby losowej otrzymamy przedział $(\theta_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \theta_2(x_1, x_2, \dots, x_n))$ taki, że

$$\theta \in (\theta_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \theta_2(x_1, x_2, \dots, x_n)),$$

dla innych realizacji - taki, że

$$\theta \notin (\theta_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \theta_2(x_1, x_2, \dots, x_n)).$$

Warunek (1) gwarantuje nam, że dla dużej liczby realizacji procent otrzymanych przedziałów takich, że zachodzi $\theta \in (\theta_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \theta_2(x_1, x_2, \dots, x_n))$ będzie w przybliżeniu równy $(1 - \alpha)100\%$.

Podstawowe statystyki próbkowe i funkcje w R wyliczające te statystyki	
średnia z próby: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$ > mean(dane)	wariancja z próby: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2$ > var(dane)

Oznaczenia podstawowych kwantyli i funkcje w R wyliczające te kwantyle		
dla rozkładu normalnego z_α > qnorm(α)	dla rozkładu t-Studenta $t_{\alpha,n}$ > qt(α, n)	dla rozkładu chi-kwadrat $\chi_{\alpha,n}^2$ > qchisq(α, n)

Przedziały ufności na poziomie ufności $1 - \alpha$	
dla wartości średniej μ	dla wariancji σ^2 (odchylenia standardowego σ)
Model I. Cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$, μ - nieznane, σ - znane	
$\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	
Model II. Cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$, μ - nieznane, σ - nieznane	
$\bar{x} - t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$ > t.test(x, conf.level)\$conf.int gdzie: x określa wektor z danymi, conf.level określa poziom ufności	$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}$
Model III. Cecha X ma rozkład dowolny o skończonej wariancji, próba jest duża ($n \geq 100$)	
$\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$	
Model IV. Cecha X ma rozkład dwupunktowy $P(X = 1) = p, P(X = 0) = q = 1 - p$, p - nieznane	
$\hat{p} = \frac{k}{n} = \frac{\text{ilość sukcesów}}{\text{ilość prób}}, \hat{q} = 1 - \hat{p}$ > binom.test(x, n, conf.level)\$conf.int gdzie: x i n określają liczbę sukcesów i liczbę prób, conf.level określa poziom ufności. Jeśli n jest duże i $n\hat{p} > 5$ i $n\hat{q} > 5$, to można wyznaczyć przybliżony przedział asymptotyczny używając: > prop.test(x, n, conf.level)\$conf.int	

Wyznaczanie niezbędnej ilości pomiarów do próby do oszacowania wartości średniej μ z maksymalnym błędem d na poziomie ufności $(1-\alpha)$
Model I. Cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$, μ - nieznane, σ - znane $n \geq (z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{d})^2$
Model II. Cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$, μ - nieznane, σ - nieznane $n \geq (t_{1-\alpha/2, n_0-1} \frac{s_0}{d})^2$ gdzie n_0 i s_0 to licznosc i odchylenie standardowe pobranej próby wstępnej
Model III. Cecha X ma rozkład dowolny o skończonej wariancji, próba jest duża ($n \geq 100$) $n \geq (z_{1-\alpha/2} \frac{s_0}{d})^2$ gdzie s_0 jest odchyleniem standardowym pobranej próby wstępnej
Model IV. Cecha X ma rozkład dwupunktowy $P(X = 1) = p, P(X = 0) = q = 1 - p$, p - nieznane $n \geq z_{1-\alpha/2}^2 \frac{p_0 q_0}{d^2}$ jeżeli znany jest szacunkowy procent p_0 (wtedy $q_0 = 1 - p_0$) $n \geq z_{1-\alpha/2}^2 \frac{1}{4d^2}$ jeżeli nie jest znany szacunkowy procent p_0